

proXAS



TABLE-TOP **NEXAFS** SYSTEM
桌面近边X射线吸收精细结构谱仪

XUV
XAS



hpspectroscopy


主要特点

一体化NEXAFS 系统

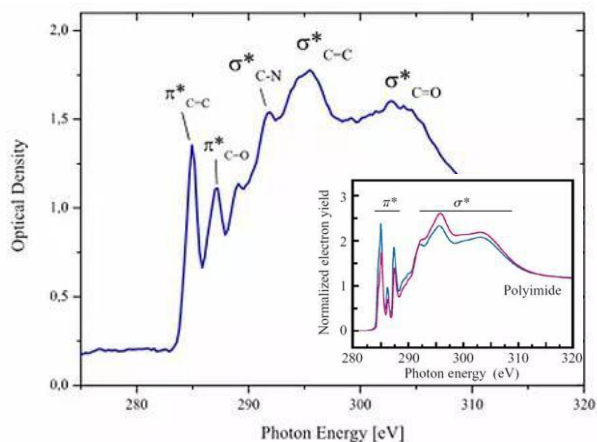
- 一体化桌面NEXAFS系统
- 不再需要申请和等待同步辐射时机时
- 用于地质、生物、材料研究的化学态分析
- 多道址复色光同时采集的快速采集光路

同步辐射级的光谱质量

- 能量范围200eV到1200eV
- 能量分辨高达1900
- 极高的表面灵敏度
- 分子轨道，氧化态，配位数等信息
- 含用于光谱分析的软件

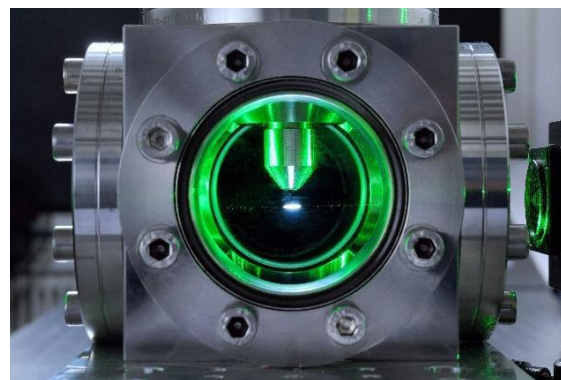
应用

- 分析有机物质，例如:脂质膜，腐殖酸，聚合物膜，特别是在碳的k吸收边
- C, N, O, Ca, K, Ti的表面敏感化学分析



用桌面系统测试200nm聚酰亚胺薄膜的碳K边NEXAFS光谱（60发脉冲平均值）。插图为桌面系统测试结果与同步辐射的比较。

(data courtesy of Dr. K. Mann, IFNANO)



XUV光源使用高度可靠的激光等离子体产生。能量范围200-1200eV。重复频率25Hz。

proXAS



主要参数

光源	无碎片的激光驱动 XUV 光源
能量范围	200-1200eV / 1-6nm
重复频率	25Hz
光源功率稳定性	±1.5%
光谱仪	像差校正平场光谱仪
分辨率	1900
样品安装	多样品转轮
占地面积	1.5m x 1.0m
软件套件	集成系统控制，各种光谱校准和分析功能



请联系我们

北京众星联恒科技有限公司

北京市海淀区信息路1号国际创业园西区2号楼1305

电话: +86-10-86467571 邮箱:sales@top-unistar.com

关注我们

hpspectroscopy

The logo for HP Spectroscopy consists of the text 'hpspectroscopy' in a bold, lowercase sans-serif font. Below the text is a graphic element consisting of a series of vertical blue bars of varying heights, creating a stylized 'h' or a bar chart effect.